Фазовые переходы в магнитоэлектрических композитах $x PbZr_{0.53}Ti_{0.47}O_3 - (1 - x)Mn_{0.4}Zn_{0.6}Fe_2O_4$

© С.А. Гриднев, А.В. Калгин

Воронежский государственный технический университет, Воронеж, Россия

E-mail: kalgin_alexandr@mail.ru

Изучены упругие, неупругие и диэлектрические свойства магнитоэлектрического композита $x PbZr_{0.53}Ti_{0.47}O_3 - (1 - x)Mn_{0.4}Zn_{0.6}Fe_2O_4$ (PZT-MZF) в интервале температур от комнатной до 673 К. Обнаружено влияние сегнетоэлектрической фазы PZT на магнитный фазовый переход и магнитной фазы MZF на сегнетоэлектрический переход. Установлено, что по мере увеличения содержания PZT происходит уменьшение размытия фазового перехода и постепенный переход от ясно выраженного релаксорного к более упорядоченному сегнетоэлектрическому поведению.

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (грант № 07-02-00228) и CRDF (проект № РG 05-010-1).

PACS: 61.46.Df, 75.50.Kj

1. Введение

Мультиферроичные композиты типа ферромагнетик-сегнетоэлектрик вызывают большой интерес исследователей ввиду широких возможностей и их практического применения, поскольку в них магнитный параметр порядка можно изменять электрическим полем, и наоборот [1]. Для создания композитов, обладающих эффективной магнитоэлектрической связью, используют различные методы: эпитаксиальный рост пленок на подложках [2], лазерную абляцию [3], ионно-лучевое распыление [4], получение многослойных структур [5] и др. Одним из наиболее простых методов является изготовление композитов путем спекания порошков сегнетоэлектрических и ферромагнитных материалов по керамической технологии [6]. Однако в результате высокотемпературного спекания магнитоэлектрических композитов может происходить изменение состава и свойств, а также фазовых переходов ($\Phi\Pi$) в магнитных и сегнетоэлектрических гранулах. Существует сравнительно небольшое количество работ, в которых приводятся сведения о влиянии состава композита на магнитные или сегнетоэлектрические ФП в смесевых композитах, что послужило стимулом для проведения экспериментов по изучению сегнетоэлектрического и магнитного ФП в настоящей работе.

2. Методика измерения и образцы

Смесевые композиты x PZT-(1-x)MZF (с x = 0, 0.2, 0.4, 0.6, 0.8 и 1) были изготовлены по стандартной керамической технологии [7]. Спекание смесей промышленных порошков феррита MZT и сегнетоэлектрика PZT, взятых в заданном соотношении, проводилось в атмосфере воздуха при температуре 1170–1200°C в течение 5 h.

Измерения диэлектрической проницаемости ε' образцов осуществлялись с помощью измерителя иммитанса E7-20 на частотах, лежащих в интервале 100 Hz-200 kHz, при нагреве со скоростью 2 K/min в диапазоне температур от комнатной до 673 K. Измерения модуля упругости G и внутреннего трения Q^{-1} были выполнены методом крутильного маятника на частоте ~ 30 Hz. Регулировку и контроль температуры осуществляли с помощью хромель-алюмелевой термо-пары с погрешностью не более ± 0.5 K.

Используемые в диэлектрических экспериментах образцы композитов имели размеры $8 \times 4.5 \times 1.5$ mm. Электроды на наибольшие поверхности образцов наносились вжиганием серебряной пасты при 873 К в течение 30 min. Размеры образцов для измерения G и Q^{-1} составляли $12 \times 2 \times 2$ mm.

Рентгеноструктурный анализ изученных образцов был проведен с помощью дифрактометра ДРОН-3 при FeK_q-излучении для всех составов композита. Типичная дифрактограмма для композита x PZT - (1 - x) MZFс x = 0.6 представлена на рис. 1, *а*. Рентгеновский анализ подтвердил присутствие в полученных композитах только двух фаз (со структурами перовскита и шпинели). Обнаружено, что увеличение содержания феррита в композиционном материале приводит к уменьшению интенсивности рефлексов для PZT и увеличению интенсивности рефлексов, соответствующих MZF. Согласно [8], по интенсивностям рентгеновских рефлексов, соответствующих фазам перовскита и шпинели, было рассчитано соотношение входящих в композит фаз. Рассчитанное соотношение оказалось близким к массовому соотношению, которое использовалось при расчете шихты для синтеза. Представленое на рис. 1, *b* изображение поверхности композита в сканирующем электронном микроскопе Jeol JSM-6380 LV также свидетельствует о наличии двух фаз в гранулах со средним размером $\sim 5\,\mu{\rm m}.$

3. Результаты и обсуждение

Для выявления влияния магнитной и сегнетоэлектрической составляющих изученного композита на ФП



Рис. 1. Рентгеновская штрихдиаграмма (*a*) и микрофотография поверхности (*b*) для композита 0.6 РZT-0.4MZF.

был использован метод внутреннего трения, характеризующийся высокой чувствительностью к структурным изменениям. Температурные зависимости Q^{-1} и G для образцов с x = 0.6 и 1 показаны на рис. 2. Видно, что в чистом PZT ярко выражен сегнетоэлектрический ФП с $T_C = 593$ K, о чем свидетельствует наличие пика Q^{-1} и резкого скачка на температурной зависимости G. Температура Тс определялась как температура, соответствующая точке перегиба на зависимости G(T). Установлено, что она хорошо совпадает с температурой пика є. Для объяснения природы аномальных потерь Q^{-1} вблизи Т_С в сегнетоэлектрической фазе можно использовать механизм релаксации низкочастотых механических колебаний при фазовых переходах первого рода, основанный на термофлуктуационном возникновении зародышей новой фазы и движении фазовой границы через систему стопоров [9]. Под влиянием внешних напряжений изменяются величина и энергия критического зародыша, что приводит к изменению скорости образования новой фазы и к возникновению большой неупругой деформации, т.е. к пику Q^{-1} . Для случая достаточно малых амплитуд свободных колебаний образца модель [9] дает следующее выражение для высоты пика внутреннего трения:

$$Q^{-1} = \frac{G\beta a^2}{kT} \frac{m}{\omega},\tag{1}$$

где m — скорость фазового превращения, β — эффективное значение объема зародыша новой фазы, G — модуль сдвига, a — спонтанная деформация в T_C , k — постоянная Больцмана.

Формула (1) позволяет оценить величину скачка спонтанной деформации а при ФП в разных по составу композитах, используя известные из эксперимента значения Q^{-1}, G, ω и *m* и взяв значение $\beta = 10^{-23} \, {\rm m}^3$ равным величине объема Кенцига. Скорость фазового превращения т определялась методом численного интегрирования кривой Q^{-1} при известной скорости изменения температуры. Взяв экспериментальные данные $m = 0.7 \cdot 10^{-4} \text{ s}^{-1}$, $f = \omega/2\pi = 30 \text{ Hz}$, G = 21 GPa, $Q_m^{-1} = 0.03$ и $T_m = 548$ К из рис. 2, b и подставив их в формулу (1), мы получили a = 0.022 для состава с x = 0.6. Аналогично были рассчитаны значения спонтанной деформации a для образцов с x = 1.0, 0.8 и 0.4, которые составили 0.031, 0.027 и 0.020 соответственно. Уменьшение *a* с ростом содержания MZF в изученном композите свидетельствует о том, что ФП теряет при-



Рис. 2. Зависимость внутреннего трения Q^{-1} и модуля упругости *G* от температуры в композиционном материале *x*PZT-(1-x)MZF с x = 1 (*a*) и 0.6 (*b*).



Рис. 3. Температурная зависимость магнитного отклика композита x PZT-(1 - x) MZF с x = 0. На вставке — изменение T_N с массовой долей феррита x.



Рис. 4. Температурная зависимость диэлектрической проницаемости для композита xPZT-(1 - x)MZF с x = 1 (*a*) и 0.4 (*b*).

знаки ФП первого рода и что сегнетоэлектрический ФП последовательно размывается.

Анализ данных, приведенных на рис. 2, *b* для композита с x = 0.6, выявил, что в нем $T_C = 540$ K, т.е. ФП смещен вниз по шкале температур по сравнению с чистым РZT. Отметим, что последовательное понижение T_C наблюдалось также для композитов с x = 0.2 и 0.8, где T_C составила 455 и 580 K соответственно. Смещение T_C в сторону низких температур можно объяснить изменением "химического давления", связанным с замещением ионов Ті сегнетоэлектрической фазы ионами Fe из магнитной фазы, имеющими больший ионный радиус.

Обнаружено, что сегнетоэлектрическая компонента также влияет на магнитный фазовый переход в гранулах феррита, который определялся по измерениям температурных зависимостей индуктивности измерительной катушки L, намотанной на образец композита. Типичная зависимость L(T) для чистого MZF приведена на рис. 3. Аналогичные зависимости были получены и для x = 0.2, 0.4 и 0.6. Анализ кривых показал, что температура магнитного фазового перехода T_N смщается к низким температурам с ростом содержания сегнетоэлектрической компоненты в изученном композите (вставка на рис. 3).

диэлектрических Измерения свойств системы PZT-MZF подтвердили предположение о том, что сегнетоэлектрический $\Phi\Pi$ размывается с ростом *x* (рис. 4). На рис. 4, а можно увидеть, что в классическом сегнетоэлектрике PZT переход из сегнето- и параэлектрическую фазу происходит при 593 К. Добавка феррита в композит приводит к тому, что максимум на кривой $\varepsilon'(T)$ становится более широким; кроме того, он уменьшается по высоте и смещается к более высоким температурам с увеличением частоты измерительного поля (рис. 4, b). Это находится в полном соответствии с изменением величины скачка спонтанной деформации а в различных по составу композитах. Размытие ФП может быть связано с композиционным разупорядочением катионов в решетке перовскита.

Температурные зависимости диэлектрических свойств в окрестности сегнетоэлектрического ФП в изученных композитах достаточно хорошо аппроксимируются модифицированным законом Кюри–Вейсса [10]

$$\frac{1}{\varepsilon(f,T)} = \frac{1}{\varepsilon_m(f)} \left\{ 1 + \frac{[T - T_m(f)]^y}{2\sigma^2} \right\},\tag{2}$$

где ε_m — диэлектрическая проницаемость при T_m , у — показатель степени, равный 1 для обычных сегнето-



Рис. 5. Зависимости y(x) и $\sigma(x)$ для композита xPZT-(1-x)MZF с x = 0.2, 0.6, 0.8, 0.9 и 1.0.

электриков и равный 2 для сегнетоэлектриков с сильно размытым $\Phi\Pi$, σ — параметр размытия $\Phi\Pi$.

Величина коэффициента у в выражении (2) определялась из зависимости $\ln(\varepsilon_m/\varepsilon - 1)$, построенной на рис. 5 как функция $\ln(T - T_m)$ для области температур, которую занимает пик $\varepsilon'(T)$. Нетрудно убедиться, что параметр размытия σ увеличивается от 4 до 52 K с уменьшением x, свидетельствуя о том, что изучаемая система становится менее динамически гетерогенной. Это же подтверждает зависимость y(x) на рис. 5.

Список литературы

- [1] M. Fiebig. J. Phys. D.: Appl. Phys. 38, R (123) (2005).
- [2] C.G. Zhong, Q. Jiang, J. Phys. D: Appl. Phys. 41, 115 002 (2008).
- [3] J.-quo Wan, Y. Weng, Y. Wu, Z. Li, J.-ming Liu, G. Wang. Nanotechnology 18, 465 708 (2007).
- [4] S.A. Gridnev, A.G. Gorshkov, Yu.E. Kalinin, A.V. Sitnikov. Ferroelectrics 359, 86 (2007).
- [5] D.A. Pan, Y. Bai, W.Y. Chu, L.J. Qiao. J. Phys.: Cond. Matter 20, 025 203 (2008).
- [6] R.S. Devan, C.M. Kanamadi, S.A. Lokare, B.K. Chougule. Smart Mater. Struct. 15, 1877 (2006).
- [7] К. Окадзаки. Технология керамических материалов. Энергия, М. (1976).
- [8] R.S. Devan, S.B. Deshpande, B.K. Chougule. J. Phys. D: Appl. Phys. 40, 1868 (2007).
- [9] S.A. Gridnev. Ferroelectrics 112, 107 (1990).
- [10] W.C. Liu, C.L. Mak, K.H. Wong, C.Y. Lo, S.W. Or, W. Zhou, A. Hauser, F.Y. Yang, R. Sooryakumar. J. Phys. D: Appl. Phys. 41, 1 (2008).